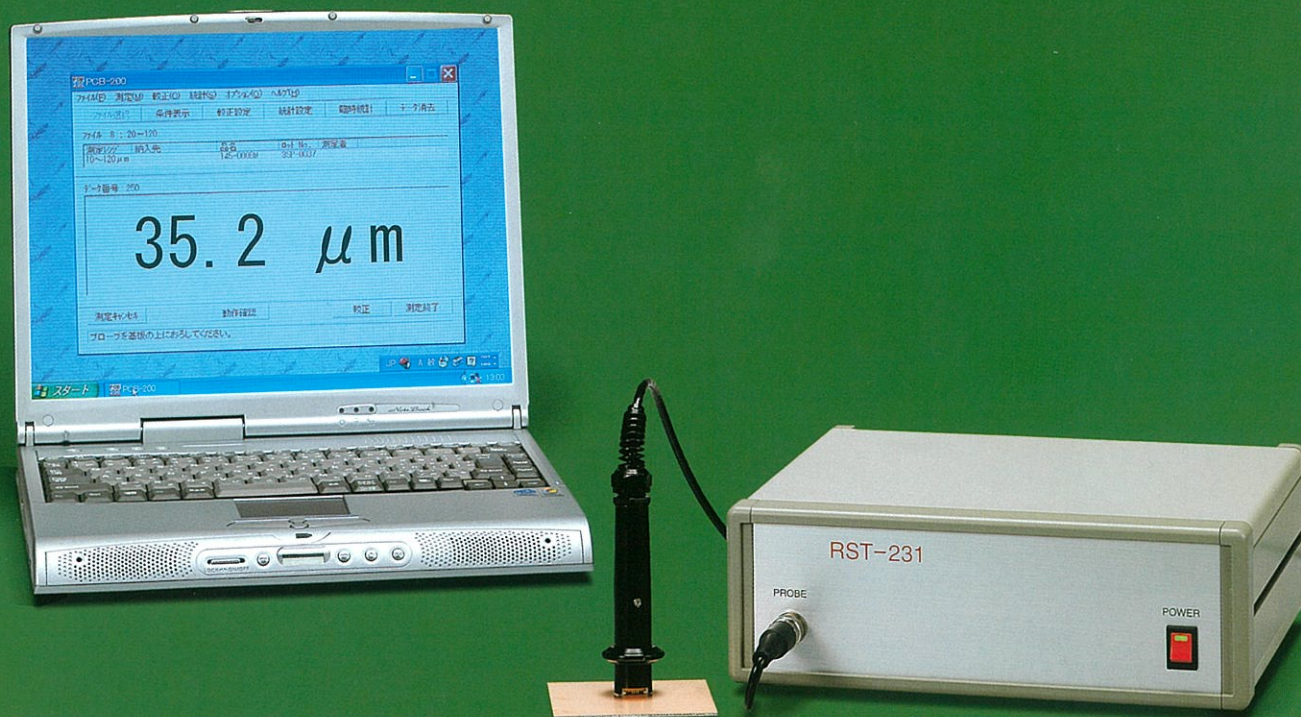


# 電気抵抗式膜厚計 RST-231



株式会社 電 測

DENSOKU INSTRUMENTS CO.,LTD.



# 電気抵抗式膜厚計 RST-231

## 時代のニーズに応える新システム



### 特 長

- 絶縁物上の金属皮膜（プリント基板の銅箔・メッキ等）を短時間（0.7秒）に高精度で測定できる。
- 4探針プローブ（ケルビン式）を採用しており、両面基板や多層基板も裏面や内部層の影響を受けず高精度の測定ができる。
- パソコン使用で画面が大きく、明るく、見易い。
- 校正や測定の操作が簡単。2種類の測定レンジが選択でき、2～120 $\mu\text{m}$ の金属皮膜の測定ができる。
- 40チャンネルまで登録できるので、ユーザー名や部品番号等により別々の登録をしてチャンネルの管理ができる。
- 測定データをチャンネルごとに保存でき、測定データに対し後から統計項目を設定し統計処理を行うことができる。
- 統計処理、ヒストグラム、プロファイル、 $\bar{x}$ -R管理図がいつでもすぐに見られる。
- 膜厚の上下限を設定しておくとも異常値に対して通知をする。
- プローブの探針を破損した場合、探針1本ごとに交換でき、低価格での修理が可能。

## 測定原理

プローブには直線上に4本の金属ピン(探針)が立っています。

この4本の探針を測定する絶縁物上の金属箔や金属メッキ面に接触させます。

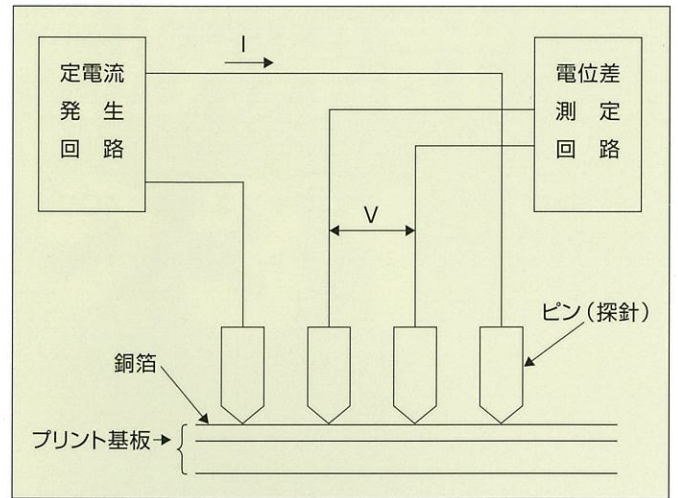
外側の2本の探針に一定の電流(I)を流し、電圧(V)を測定します。

探針を接触させている金属箔や金属メッキの厚さ(T)は、一定の条件下では下記の式で計算できます。

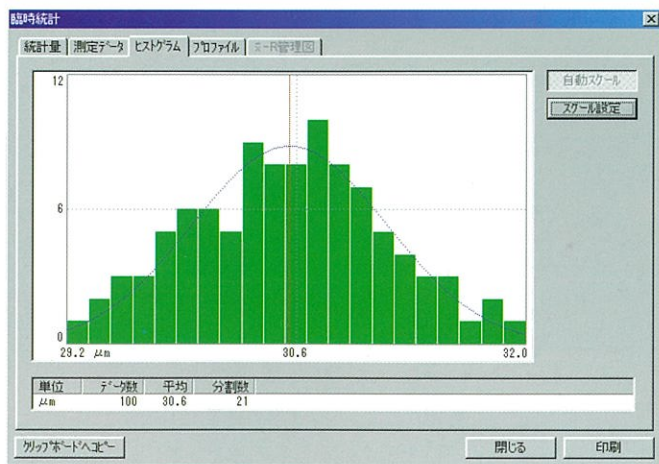
$$T = K \times I \div V$$

ここではKは定数

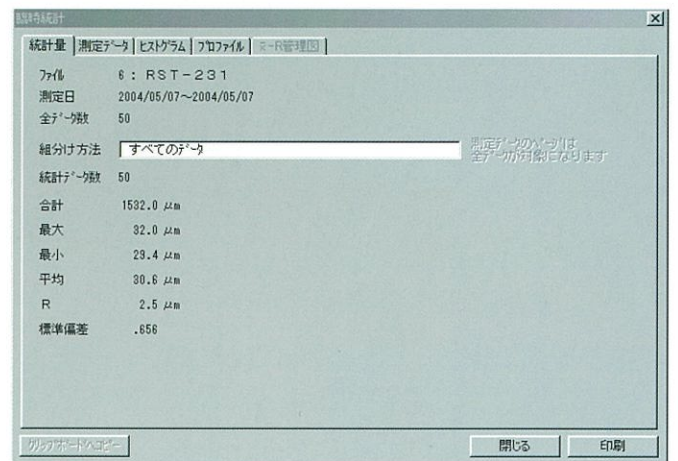
従って、内側の2本の探針間の電圧を測定すれば、金属箔や金属メッキの厚さを測定できます。



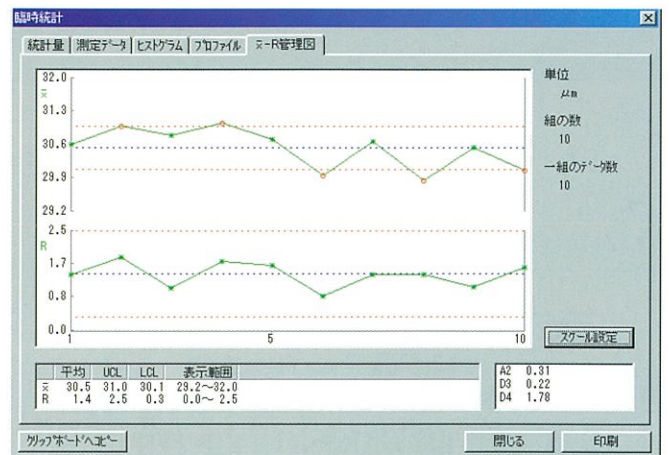
## 統計表示画面



ヒストグラム



統計量表示



$\bar{x}$ -R管理図



## 標準仕様

型式(本体) : RST-231型  
測定原理 : 4探針電気抵抗式  
測定レンジ : 2~24 $\mu$ m、10~120 $\mu$ m  
チャンネル数 : 40チャンネル  
データ容量 : 100,000データ  
表示 : パソコンモニタ画面による  
統計処理 : 最大値、最小値、平均値、標準偏差、  
ヒストグラム、上下限值設定  
電源 : AC100~240V $\pm$ 10%  
50/60Hz、10VA(本体)  
寸法 : 280(W) $\times$ 230(D) $\times$ 88(H)(本体)  
付属品 : 4探針プローブ KD-110  
標準板 TCU-145

## 4探針プローブ(ケルビン式)仕様

	探針間隔	探針先端	
KD-110	1mm	0.1R	標準品
KD-105	1mm	0.05R	
KD-210	2mm	0.1R	

※上記仕様外のプローブはご相談下さい。

(注)仕様は予告なく変更されることがあります。

株式会社 電 測

〒164-0011 東京都中野区中央2丁目31番5号  
TEL. (03) 3365-4411 FAX. (03) 3371-1287

**DENSOKU INSTRUMENTS CO.,LTD.**

2-31-5 Chuo, Nakanoku, Tokyo, Japan

URL <http://www.densoku-jp.co.jp>

E-mail [eigy@densoku-jp.co.jp](mailto:eigy@densoku-jp.co.jp)

代理店